

電磁気応用部門, 磁粉・浸透・目視部門, 漏れ試験部門 合同シンポジウム
第 27 回 表面探傷シンポジウム
「表面探傷技術による健全性診断,品質検査」

非破壊検査技術は, 産業や生活を支える自動車,鉄道や航空などの交通・流通インフラや発電所や各種プラントなどのエネルギー・産業インフラの健全性診断や,さらにはそのインフラを製造する段階での各種素材や部品,さらには設備全体の品質検査など,その対象範囲は極めて広いものがあります。

しかしながら,高度経済成長期に大量に建造された老朽化したインフラの効率のよい診断や,省エネルギーを達成するために高強度化が進む素材への品質検査には,まだ課題も多く,今後も継続した技術開発や適用開発が必要な状況でもあります。

電場・磁場から電磁波・光,液体から気体までも含めて,表面における様々な現象や応答を手がかりとする多様な検査手法を培ってきた表面探傷分野は,さらにその性能や応用分野を広げる潜在能力を有し,その発展により社会に大きく貢献できるものと考えられます。

本シンポジウムは,こうした表面探傷における技術やその応用に焦点をあて,多方面から広く講演を募集して,現時点における技術水準と今後の動向,表面探傷技術が果たすべき役割などについて,幅広い分野の人たちに意見交換していただける場となればと希望しています。

日時: 2024年3月19日(火)10:15~17:00
会場: (一社)日本非破壊検査協会 6階会議室
主催: (一社)日本非破壊検査協会 電磁気応用部門, 磁粉・浸透・目視部門, 漏れ試験部門

協賛: 関係学協会
シンポジウム参加費:

JSNDI 正会員	4,000円
JSNDI 学生会員	3,000円
登壇者	4,000円
協賛学会会員	6,000円
非会員 一般	8,000円
非会員 学生	4,000円

参加申込み方法:

「学術申込 Web システム」を利用してお申込み下さい。
協会ホームページ (URL:<http://www.jsndi.jp/>) から
「学術活動」→「部門・研究会」より各部門のページへ。

プログラム

10:15 開会の挨拶

実行委員長: 電磁気応用部門主査 後藤雄治 (大分大学)

10:20~11:40 セッション1 「一般講演」

座長 笠井尚哉 (横浜国立大学)

- 1-1 電磁力加振を用いた焼割試験法の検討
大分大学 ○小松原魁, 後藤雄治
高周波熱錬(株) 二宮 渉
- 1-2 電磁力加振による大口径鋼管内部の温泉スケール厚み計測法の検討
大分大学 ○高杉亮太, 塩田真也, 生貞宏幸
丹羽章太郎, 後藤雄治
九州大学 笹山瑛由

- 1-3 音圧測定を利用した電磁力加振器による CFRP 材の探傷方法の提案
大分大学 ○細野裕一朗, 丹羽章太郎, 後藤雄治
(株)IHI 大橋タケル

- 1-4 残留応力による電磁鋼板の磁気特性変化の評価
大分大学 ○熊谷崇志, 吉村啓佑
後藤雄治, 青木仁志
(株)IHI 野瀬裕之

13:10~14:10 「特別講演」

座長 後藤雄治 (大分大学)
超音波探傷試験および電磁波レーダにおける最近のイメージング技術
(一財)電力中央研究所 ○福富広幸

14:20~15:40 セッション2 「一般講演」

- 座長 渡邊郁雄 (東芝)
- 2-1 マイクロマグネティクス法を用いた鋼材の強度特性評価に関する国内計測事例
(株)構造計画研究所 ○上谷佳祐
セフ シャハブディン, 廣瀬健康
- 2-2 渦電流探傷試験(ECT)細管検査の為に人工知能(AI)検出機能
Eddyfi Technologies ○野中直樹, 松園真一
Sisto Marco, Veilleux David
Burchell Laura, Aube David
- 2-3 逐次線形計画法を用いた非破壊電流源推定に関する基礎検討
法政大学 ○島津颯太, 山口俊輔, 中村勢到#
チェ エノク, 渥美瑛司, 岡本吉史
- 2-4 スニッフ法による漏れ試験における周囲の風の影響の評価
(国研)産業技術総合研究所 ○新井健太

15:50~16:50 セッション3 「一般講演」

- 座長 新井健太 (国研)産業技術総合研究所
- 3-1 MIセンサによる燃料電池周囲の微小磁界計測システムの開発
法政大学 ○チェ エノク, 渥美瑛司, 山口俊輔
島津颯太, 岡本吉史
- 3-2 IPMSM回転子における漏れ磁束の実測値を用いた永久磁石磁化推定
法政大学 ○中村勢到, 塩山将英, 岡本吉史
- 3-3 実際の外観試験(VT)と資格制度
(一財)日本溶接技術センター ○阿南睦章

16:50~17:00 閉会の挨拶

実行委員長: 電磁気応用部門主査 後藤雄治 (大分大学)

(注: 座長及び講演日時等は変更される場合もあります)

*講演中のカメラやスマートフォン等による撮影は原則禁止としております。撮影される場合は,事前に登壇者の了承を得た上で,登壇前に座長へ申し出るようお願いいたします。

問合せ先: 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14
京阪亀戸ビル 10階
(一社)日本非破壊検査協会 学術部学術課
「第27回 表面探傷シンポジウム」係
TEL:03-5609-4015 FAX:03-5609-4061 E-mail:
nakamura@jsndi.or.jp